

MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE (SEM)

FABRICANT : JEOL

MODÈLE : JSM 7401F

Échantillons

- Taille d'échantillons : 150 mm maximum
- Épaisseur : 5 mm maximum

Analyses

- Résolution latérale : ~ 1 nm
- Accélération : 0.1 keV à 30 keV

Variantes

- Détection d'électrons rétrodiffusés pour l'analyse de phases
- Détection et quantification des éléments par analyse dispersive en énergie (EDS) pour la détermination de la composition chimique